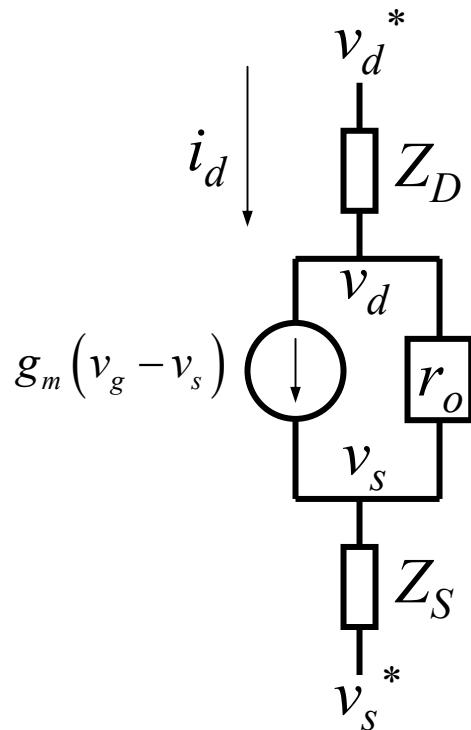
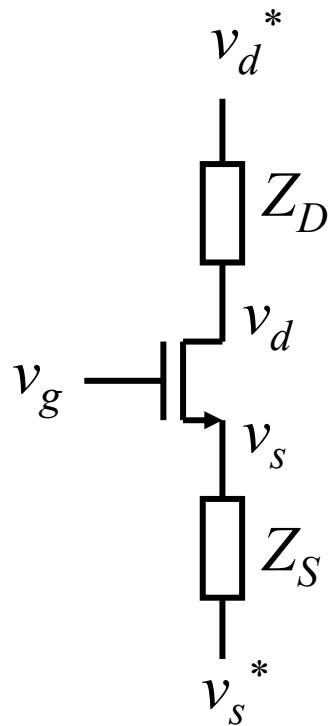


情報デバイス工学特論

第6回

CMOS基本回路(2)

増幅回路の利得



$$v_d = v_d^* - i_d Z_D$$

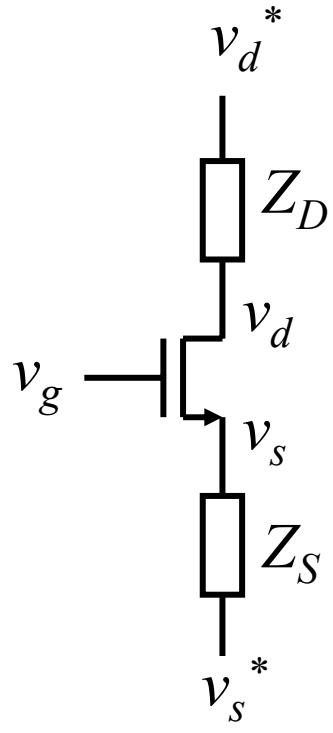
$$i_d = g_m (v_g - v_s) + \frac{v_d - v_s}{r_o}$$

$$v_s = v_s^* + i_d Z_S$$



$$i_d = \frac{g_m v_g - \left(g_m + \frac{1}{r_o} \right) v_s^* + \frac{v_d^*}{r_o}}{1 + g_m Z_S + \frac{Z_S + Z_D}{r_o}}$$

電圧電流変換係数



$$i_d = \frac{g_m v_g - \left(g_m + \frac{1}{r_o} \right) v_s^* + \frac{v_d^*}{r_o}}{1 + g_m Z_S + \frac{Z_S + Z_D}{r_o}}$$

ソース接地增幅回路

$$v_s^* = v_d^* = 0$$

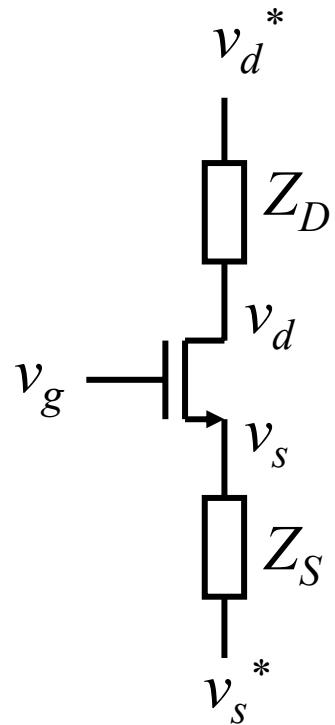
$$G_m = \frac{i_d}{v_g} = \frac{g_m r_o}{r_o + Z_S + Z_D + g_m r_o Z_S}$$

ゲート接地增幅回路

$$v_g = v_d^* = 0$$

$$G_m = \frac{-i_d}{v_s^*} = \frac{g_m r_o + 1}{r_o + Z_S + Z_D + g_m r_o Z_S}$$

出力抵抗



$$i_d = \frac{g_m v_g - \left(g_m + \frac{1}{r_o} \right) v_s^* + \frac{v_d^*}{r_o}}{1 + g_m Z_S + \frac{Z_S + Z_D}{r_o}}$$

ソース側からみた抵抗

$$v_g = v_d^* = 0$$

$$R_s^* = \frac{v_s^*}{-i_d} = \frac{r_o + (g_m r_o + 1) Z_s + Z_D}{g_m r_o + 1} \approx \frac{1}{g_m} + Z_s + \frac{Z_D}{g_m r_o}$$

ソース側から見ると Z_D は $1/g_m r_o$ 倍に見える

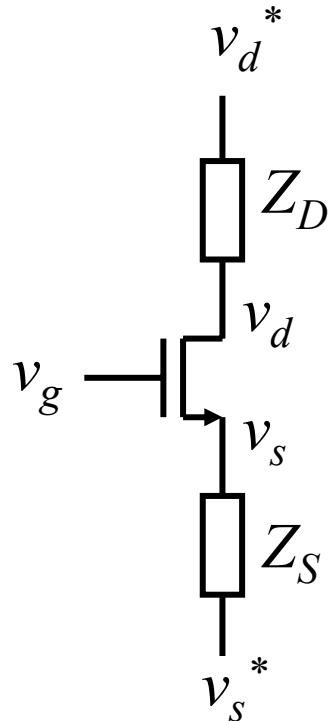
ドレイン側からみた抵抗

$$v_g = v_s^* = 0$$

$$R_d^* = \frac{v_d^*}{i_d} = r_o + (g_m r_o + 1) Z_s + Z_D \approx r_o + g_m r_o Z_s + Z_D$$

ドレイン側から見ると Z_S は $g_m r_o$ 倍に見える

電圧利得



$$i_d = \frac{g_m v_g - \left(g_m + \frac{1}{r_o} \right) v_s^* + \frac{v_d^*}{r_o}}{1 + g_m Z_S + \frac{Z_S + Z_D}{r_o}}$$

ソース接地 $v_s^* = v_d^* = 0, Z_S = 0$

$$A = \frac{v_d}{v_g} = -g_m (Z_D \parallel r_o)$$

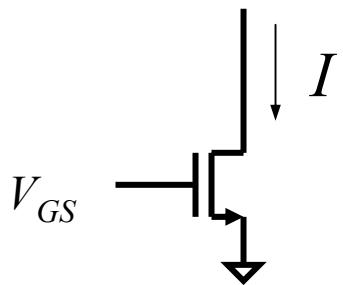
ドレイン接地 $v_s^* = v_d^* = 0, Z_D = 0$

$$A = \frac{v_s}{v_g} = \frac{g_m (Z_S \parallel r_o)}{1 + g_m (Z_S \parallel r_o)}$$

ゲート接地 $v_g = v_d^* = 0, Z_S = 0$

$$A = \frac{v_d}{v_s^*} = \left(g_m + \frac{1}{r_o} \right) (Z_D \parallel r_o)$$

電流源回路



V_{GS} を与えれば電流 I が決まる

しかし、電流は V_{GS} で大きく変化
所定の電流を与えるには精度の高い電圧 V_{GS} が必要

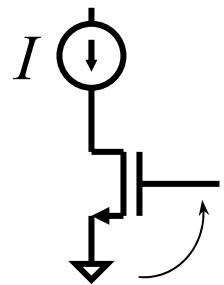


別の方法：電流をコピーする

カレント・ミラー

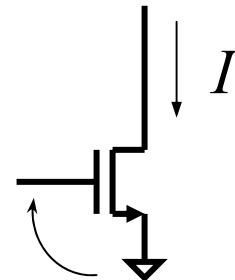
基本電流源回路

電流→電圧



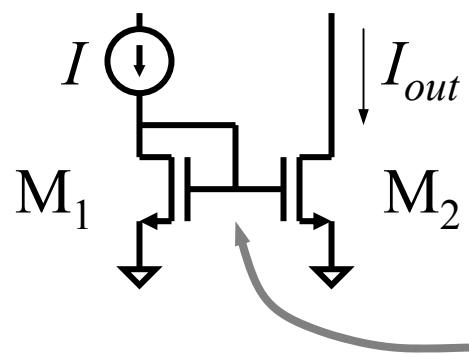
$$V_{GS} = V_T + \Delta$$

電圧→電流



$$\Delta = \sqrt{\frac{2I}{\beta}}$$

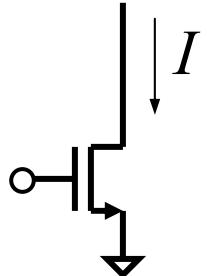
電流のコピー＝カレント・ミラー回路



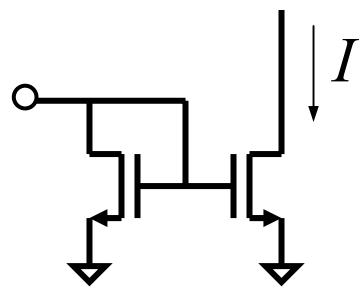
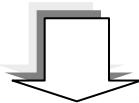
$$I_{out} = \frac{\beta_2}{\beta_1} I$$

フローティング・ノードを作らないこと

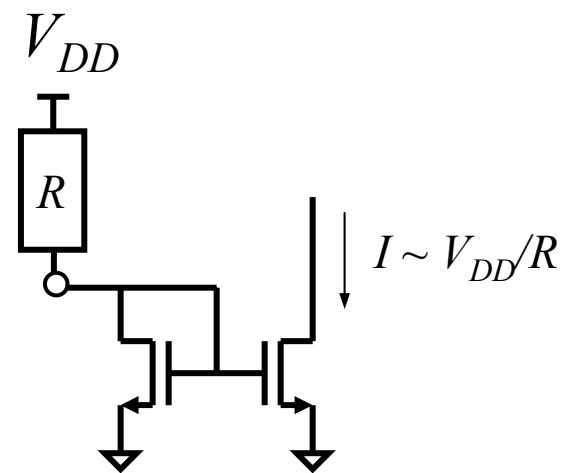
バイアス端子の外部への出し方



- ゲート電圧により電流を決めるのは困難
(閾値のばらつき)
- ゲート絶縁破壊を起こしやすい

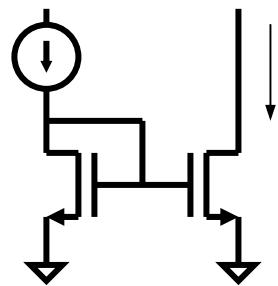


ゲートは拡散層につながって
いるのでゲート絶縁破壊に強い

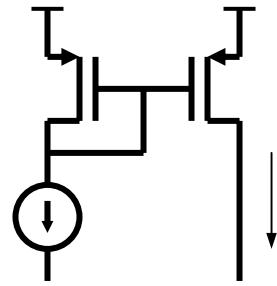


抵抗 = 最も簡単な電流源

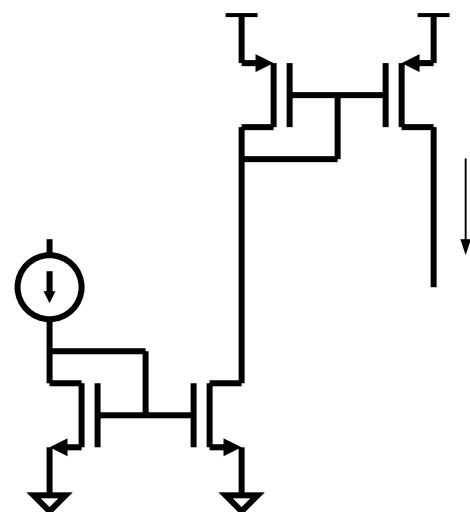
nMOSFET と pMOSFET により電流供給・電流引抜の電流源を作ることができる



電流引抜

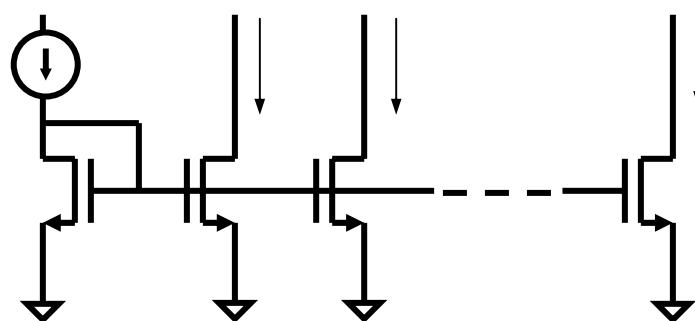


電流供給

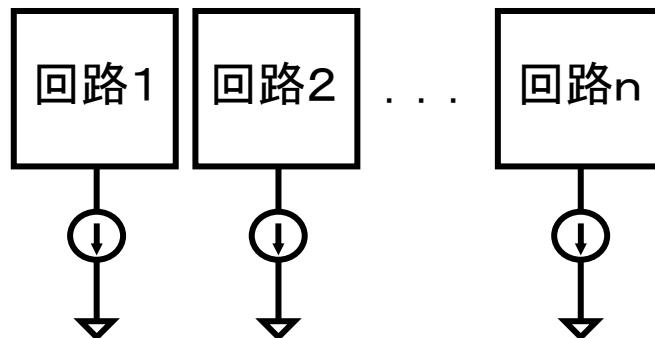


組み合わせ

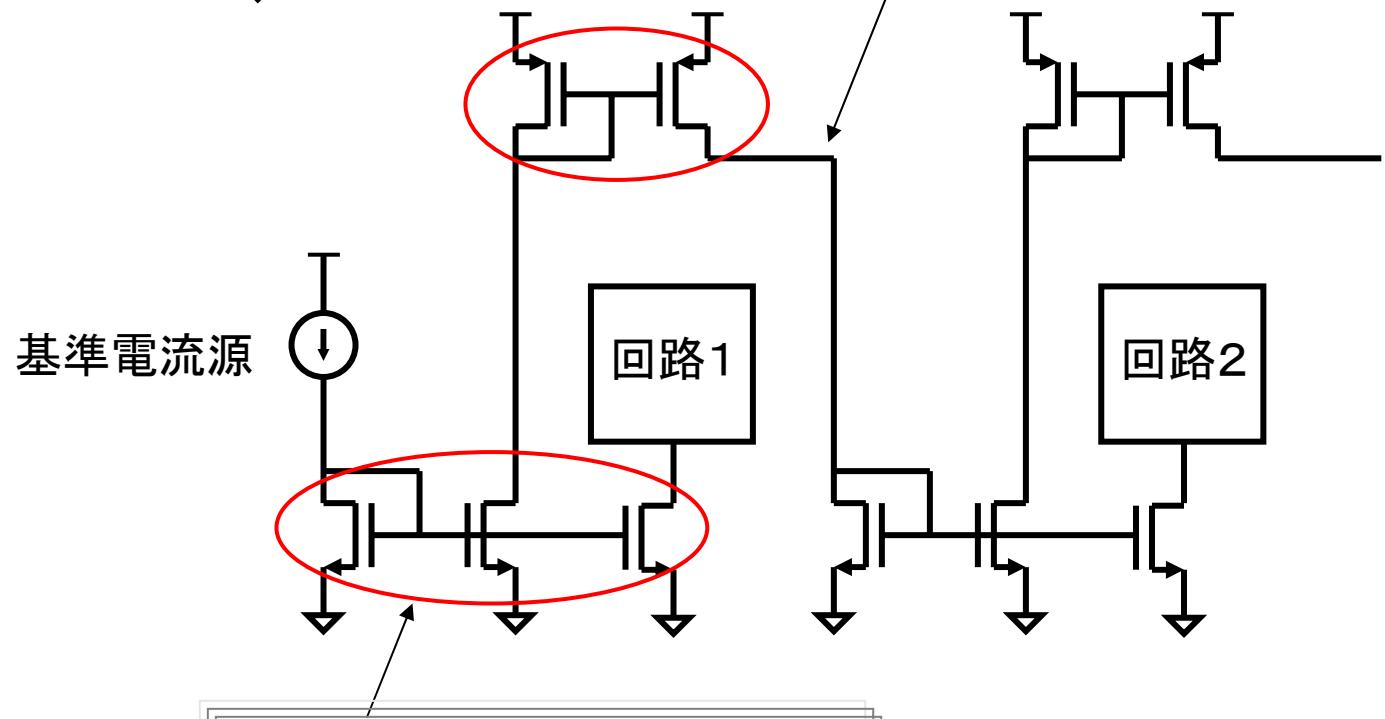
増殖



複数の回路に同じ電流を流したい

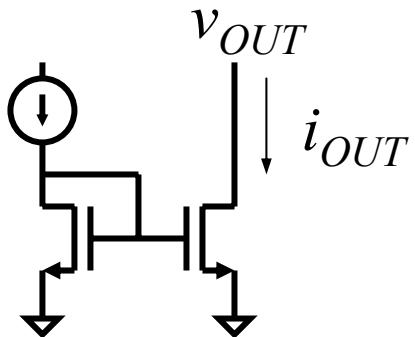


配線が長くても
電流なので抵抗
の影響を受けない



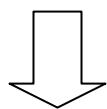
トランジスタを近接させることに
より閾値等の差を小さくする

カスコード電流源回路

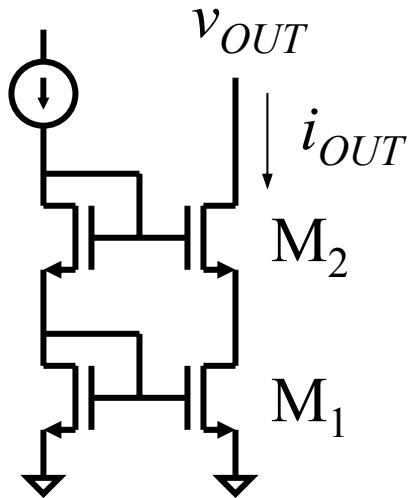


出力電圧の変動により電流が変化

$$\Delta i_{OUT} = \frac{\Delta v_{OUT}}{r_o}$$



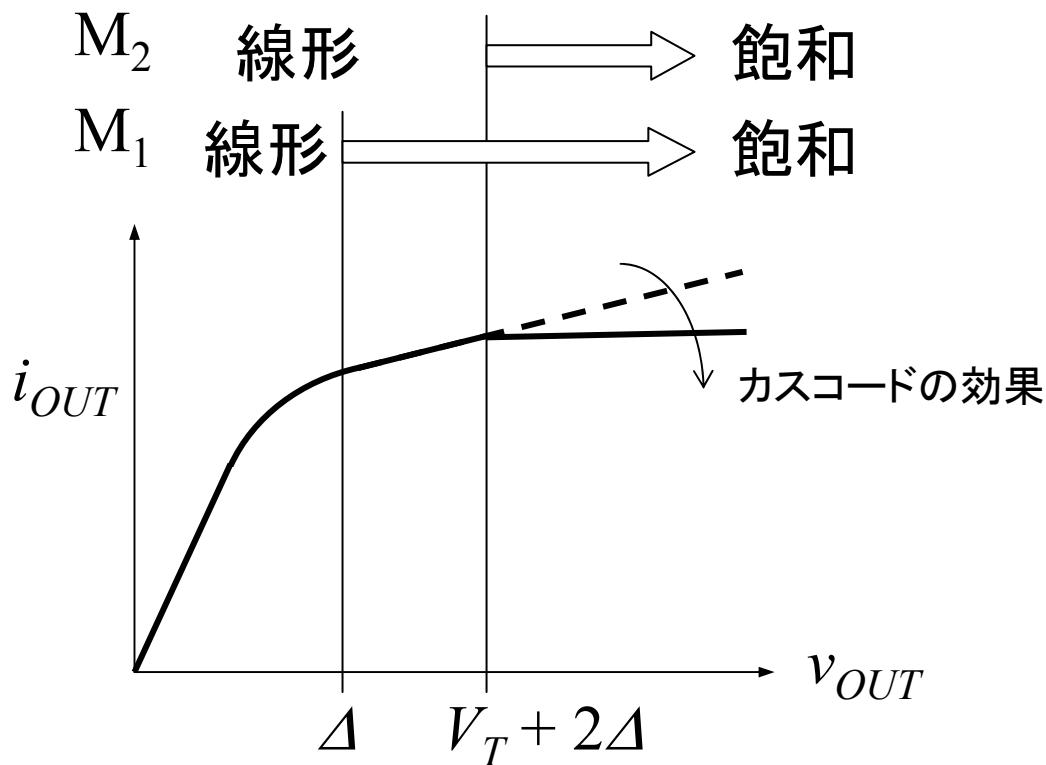
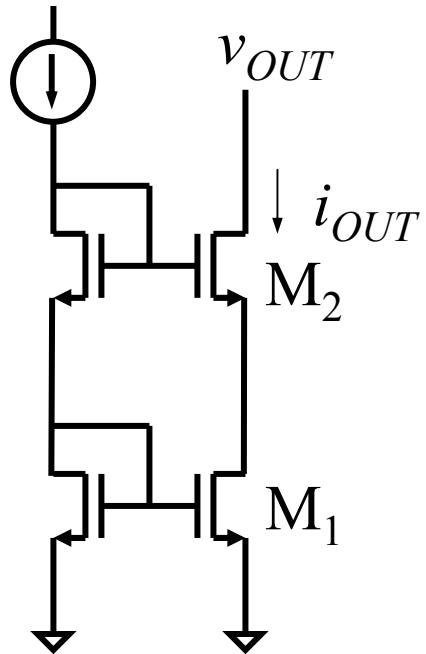
カスコード接続



v_{OUT} から見た出力抵抗
 $= M_1$ の出力抵抗 $\times M_2$ の真性ゲイン
 $= r_{o1} \times g_{m2} r_{o2}$

$$\Delta i_{OUT} = \frac{\Delta v_{OUT}}{r_{o1} g_{m2} r_{o2}}$$

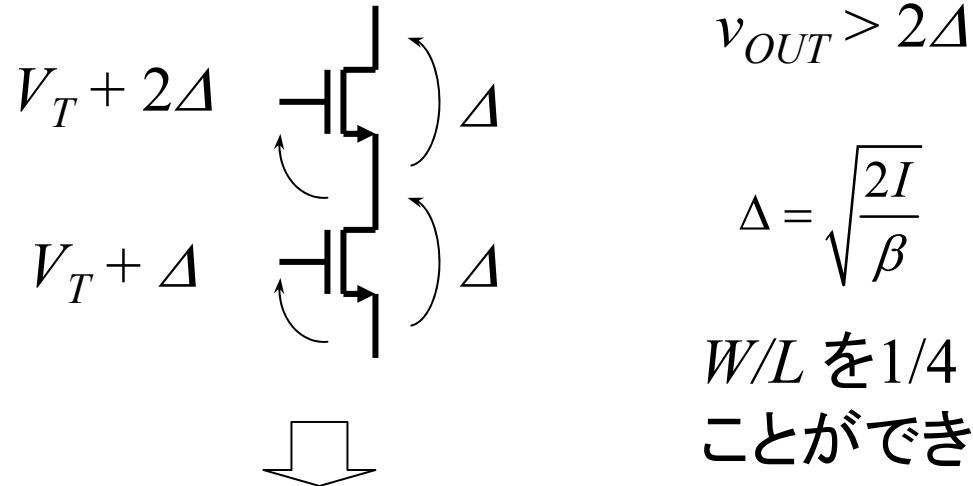
カスコード電流源回路



動作領域が狭くなる

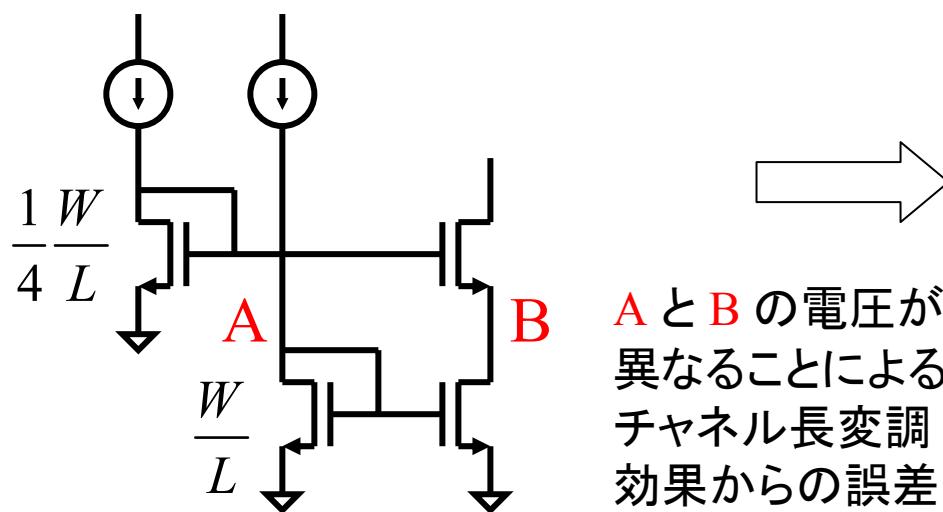
低電源電圧用電流源回路

カスコード接続での最小バイアス

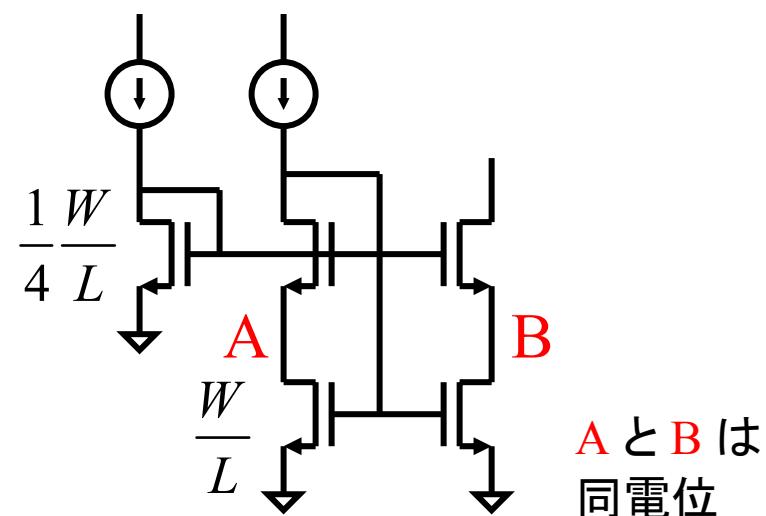


$$\Delta = \sqrt{\frac{2I}{\beta}} \quad \beta = \frac{W}{L} \mu C_{ox}$$

W/L を $1/4$ にすれば 2Δ を作ることができる

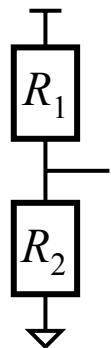


A と B の電圧が異なることによるチャンネル長変調効果からの誤差



A と B は同電位

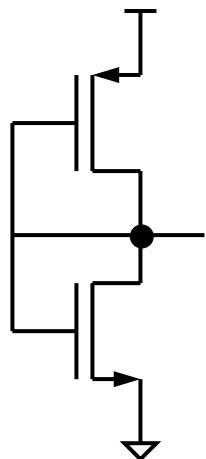
電圧源



$$V = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{DD}$$

- 抵抗は一般的に大きな領域を占める
- 電流を小さくしようとすると抵抗値が大きくなる→領域が更に大きくなる

トランジスタで作る



$$V = \frac{V_{DD} + V_{Tp} + \sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}} V_{Tn}}{1 + \sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}}}$$

外部電源電圧に依らない電源

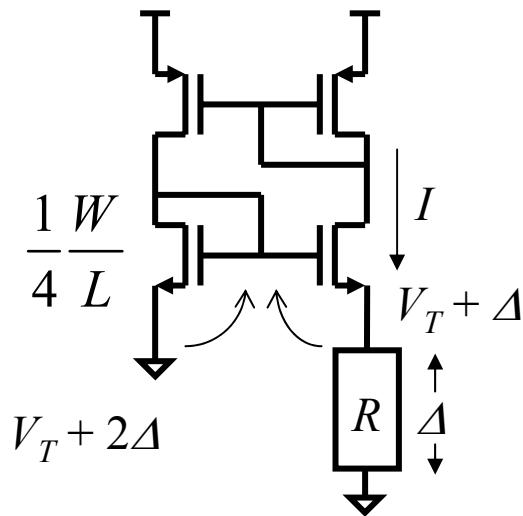
回路の安定動作：バイアス回路が重要

- ・電源電圧の変動(電池動作等)
- ・チップ製造ラインでのプロセスばらつき
- ・環境温度の変化

特に外部電源の変動に強い回路が求められる例



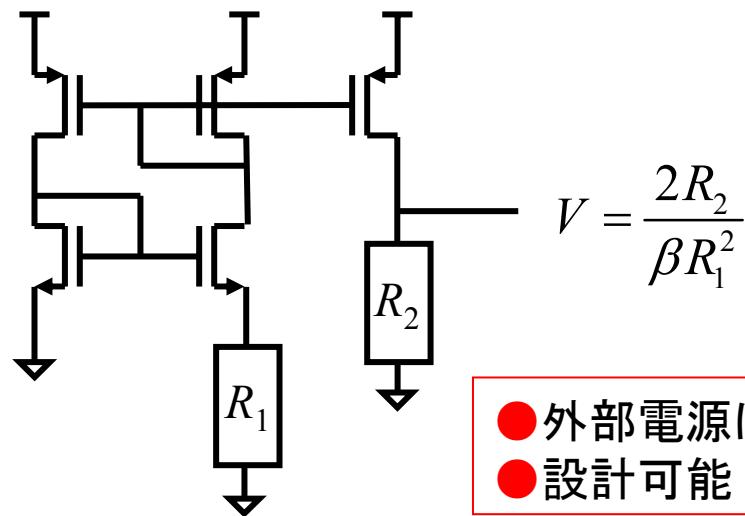
外部電源電圧に依らない電源



$$\Delta = \sqrt{\frac{2I}{\beta}} = IR$$

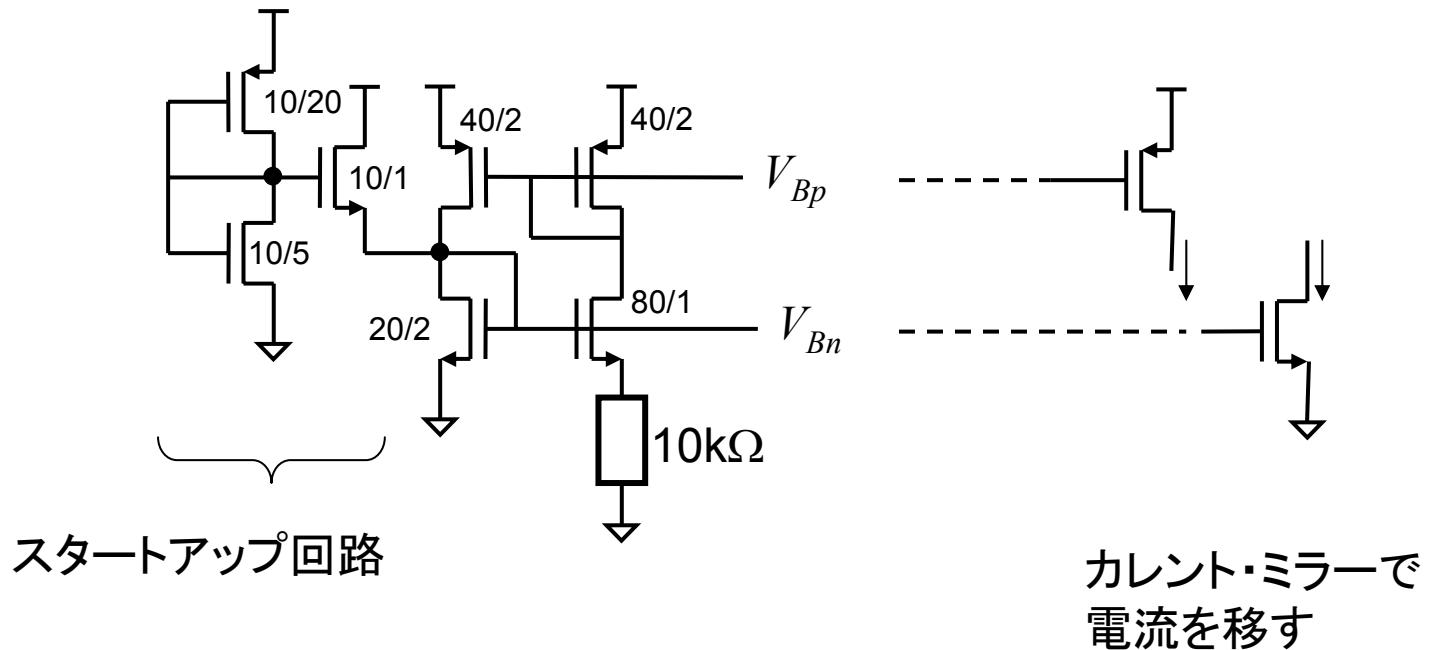


$$I = \frac{2}{\beta R^2}$$



- 外部電源に全く依存しない
- 設計可能

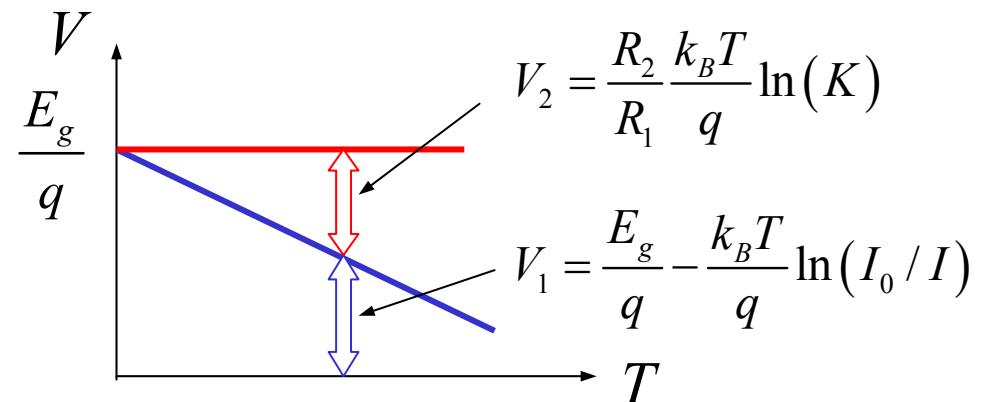
実際の回路例



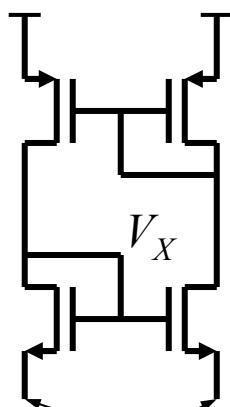
注)トランジスタサイズ W (チャネル幅)/ L (チャネル長)

バンドギャップ参照電源回路

 $I = I_0 e^{-\frac{E_g - qV}{k_B T}}$



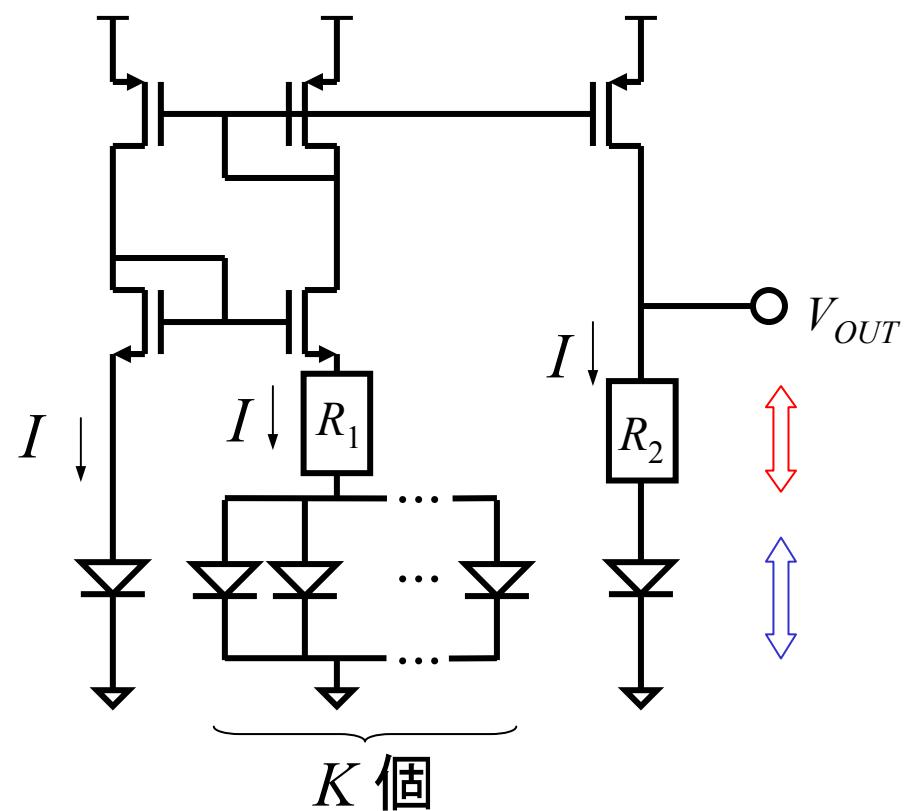
同一電流・同一電位を与える回路



カレント・ミラー
= 同一電流

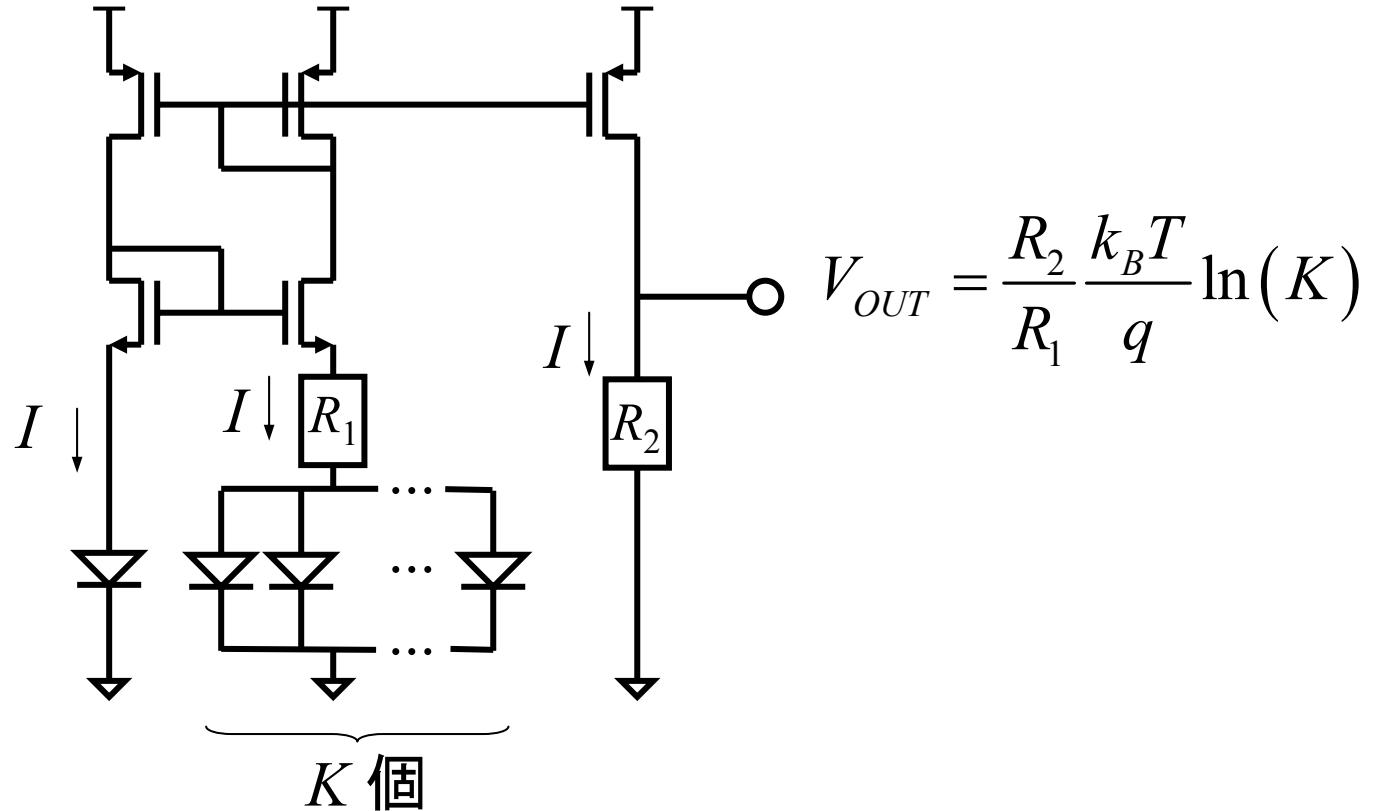
どちらの電位も

$$V_x - V_T - \Delta$$



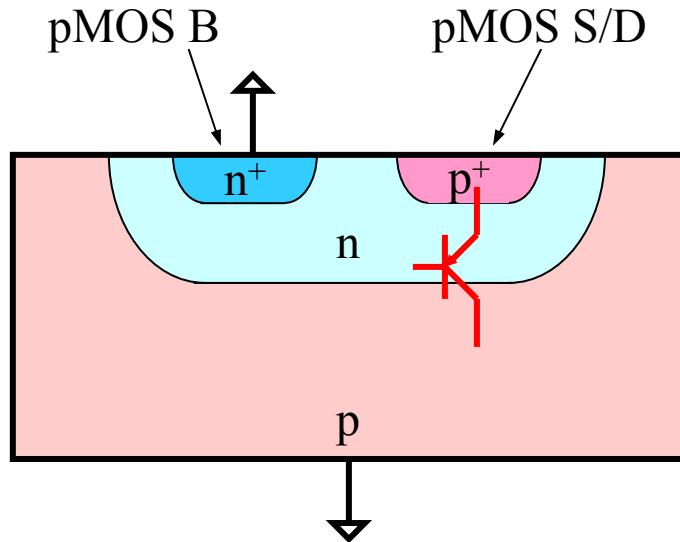
PTAT (proportional to absolute temperature)

$$I = \frac{1}{R} \frac{k_B T}{q} \ln(K)$$



ダイオードの実現方法

pn接合として寄生バイポーラ
トランジスタを用いる



$$I = I_0 e^{\frac{qV}{nk_B T}}$$

MOSFET のサブスレッショルド電流を用いることも可能

バイポーラの方が n 値が安定